PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-141644

(43)Date of publication of application: 25.05.2001

(51)Int.Cl.

GO1N 21/01 GO1N 21/27

GO1N 33/52

(21)Application number: 11-318423

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

09.11.1999

(72)Inventor: TAKI MIKI

NAGARA SHINICHI IIDA KEIICHI

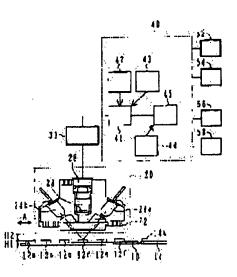
ISOBE TETSUYA

(54) REFLECTANCE MEASURING APPARATUS

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a reflectance measuring apparatus which prevents an irregularity in the distance between a measuring head and a sheet of test paper, and to provide a reflectance measuring apparatus which can prevent a reference plate from being contaminated and denatured, in which the drift of a light source is corrected in every measurement and whose measuring accuracy is enhanced.

SOLUTION: A measuring head 20 comprises light sources 24a, 24b and a photodetector 26. A reagent pad 12 on a sheet of test paper 10 as an object to be measured is irradiated with light from the light sources 24a, 24b. A reflection intensity is found on the basis of reflected light from the reagent pad 12. On the basis of a relationship with respect to a reflection intensity from an internal reference reflection plate 14a, the absolute reflectance of the reagent pad 12 is found. The reflection intensity from the internal reference reflection plate 4a is measured in the plurality of numbers of times. A density calculation part 40 judges the accuracy or the reproducibility of a reflectance measurement on the basis of measured results in the plurality of numbers of times. The distance between a conveyance base which holds the sheet of test paper 10 and the measuring head 20 can be adjusted by an adjusting screw 84. On the basis of the judged result of the accuracy or the reproducibility by the calculation part



40, a positional relationship between the reagent pad 12 and the measuring head 20 can be adjusted.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

11.07.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3650558

[Date of registration]

25.02.2005

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-141644 (P2001-141644A)

(43)公開日 平成13年5月25日(2001.5.25)

(51) Int.CL ¹	縱別	们配号	ΡI		Ŧ	-73-1 (参考)
GOIN	21/01		G01N	21/01	Z	2G045
	21/27			21/27	В	2G059
	33/52 ·			33/52	В	

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 14 頁)

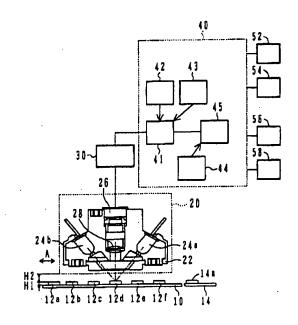
	•		AMA MARON 02 (2:119)
(21)出願番号	特數平11-318423	(71) 出願人	000005108
			株式会社日立製作所
(22)出顧日	平成11年11月9日(1999.11.9)	İ	東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地
	·	(72)発明者	海 关樹
			茨城県ひたちなか市市毛882番地 株式会
			社日立製作所計測器グループ内
	•	(72)発明者	長良 信一
			茨城県 ひたちなか市大宇市毛1040番地 株
			式会社日立サイエンスシステムズ内
	•	(74)代理人	100077816
		(14) (43)	弁理士 春日 薫
			不怪上 怪口 飘
			最終頁に絞く
		1 .	MARILES \

(54) 【発明の名称】 反射率制定装置

(57)【要約】

【課題】測光ヘッドと試験紙との間の距離のばらつきを 回避して、測定精度の向上した反射率測定装置を提供す ることにある。また、基準板の汚れ、変性を回避できる とともに、測定の度毎に、毎回光源ドリフトの補正を行 え、測定精度の向上した反射率測定装置を提供すること にある。

【解決手段】測光ヘッド20は、光源24と光検出器26を有しており、光源24からの光を被測定体である試験紙10の試薬パッド12に照射して、試薬パッド12の反射光により反射強度を求めるとともに、内部基準反射板14aからの反射強度との関係に基づいて、試薬パッド12の絶対反射率を求める。内部基準板14aからの反射強度を複数回測定し、濃度算出部40は、複数回の測定結果に基づいて、反射率測定の正確性若しくは再現性を判断する。試験紙10を保持する搬送台と測光ヘッド20の間の距離は、調整ネジ84によって調整可能であり、算出部40による正確性若しくは再現性の判断結果に基づいて、試薬パッド12と測光ヘッド20との位置関係を調節可能としている。



【特許請求の範囲】

【簡求項1】光源と受光部を有する測光へッドを有し、 光源からの光を被測定体に照射して、被測定体の反射光 を上記受光部により受光して反射強度を求めるととも に、基準反射板からの反射強度との関係に基づいて、被 測定体の絶対反射率を求める反射率測定装置において、 上記基準板からの反射強度を複数回測定し、この複数回 の測定結果に基づいて、反射率測定の正確性若しくは再 現性を判断する算出部と、上記被測定体を保持する台と 上記測光へッドの間の距離を調整する距離調整手段とを 備え、

1

上記算出部による正確性若しくは再現性の判断結果に基づいて、上記被測定体の台と上記測光ヘッドとの位置関係を調節可能としたことを特徴とする反射率測定装置。

(図5:ステップs115:出願

時削除します)

【請求項2】請求項1記載の反射率測定装置において、 さらに、

上記測光ヘッドは、複数の被測定体の上を走査可能であ り、

上記基準反射板は、上記測光ヘッドから見た反射率が等 しく、かつ、上記測光ヘッドの走査方向に離されて配置 された複数の基準反射板から構成され、

上記算出部は、これらの複数の基準反射板からの反射強度に基づいて、上記測光ヘッドの水平度を判断するとともに、

上記算出部による水平度の判断結果に基づいて、上記測 光ヘッドの水平度を調節可能としたことを特徴とする反 射率測定装置。 (図5:ステップs140)

【請求項3】請求項1記載の反射率測定装置において、 上記算出部は、上記基準板からの複数回の反射強度の測 定結果に基づいて、ドリフトの異常を判断することを特 徴とする反射率測定装置。(図5:ステップs150) 【請求項4】請求項1記載の反射率測定装置において、

上記基準板は、上記測光ヘッドから見た反射率が異なる複数の基準板から構成され、

上記算出部は、上記複数の基準板に対する反射強度の差に基づいて、感度異常を判断することを特徴とする反射 率測定装置。 (図5:ステップs160)

【請求項5】請求項1記載の反射率測定装置において、 上記基準板は、内部基準板と、外部基準板とから構成され、

上記外部基準板は、上記測光ヘッドから見た反射率が異なる複数の外部基準板から構成され、

上記算出部は、上記複数の外部基準板に対する反射強度 と、上記内部基準板に対する反射強度の差に基づいて、 上記内部基準板の汚れ度を判断することを特徴とする反 射率測定装置。 (図5:ステ

ップ s 1 3 0)

光源からの光を被測定体に照射して、被測定体の反射光を上記受光部により受光して反射強度を求めるとともに、基準反射板からの反射強度との関係に基づいて、被測定体の絶対反射率を求める反射率測定装置において、上記基準板は、内部基準板と、外部基準板とから構成され、

上記外部基準板は、上記測光ヘッドから見た反射率が異なる複数の外部基準板から構成され、この複数の外部基準板の内の一つの外部基準板の測光ヘッドから見た反射率が上記内部基準板の測光ヘッドから見た反射率と等しく設定され、

上記内部基準板に対する反射強度と、上記複数の外部基準板に対する反射鏡段との関係に基づいて、複数の補正係数を求めると共に、上記被測定体に対する反射強度と上記内部基準板に対する反射強度との関係に基づいて求められた反射率を上記複数の補正係数の内の被測定体に応じた一つの補正係数を用いて補正して絶対反射率を求める算出部を備えたことを特徴とする反射率測定装置。

(絶対反射率Rtfの算出)

20 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、未知濃度の被測定体からの反射率を濃度既知の基準板の反射強度から求める反射率測定装置に関する。

100021

【従来の技術】従来、尿検査を試験紙法で行う反射率測定装置は、かなり古くから知られている。従来の反射率測定装置においては、試薬の保持された試験紙に尿等の検体を滴下し、試薬を発色させるとともに、光源からの光を発色した試薬上に照射して、発色部からの反射光を光検出器により測定して、発色の程度、即ち、測定項目の濃度を測定している。

【0003】ここで、光源から出射する光量は時間と共に変化してドリフトするため、この光源のドリフトを補正する方法として、例えば、特開昭51-33692号公報に記載されているように、装置内部の濃度既知の基準板(内部基準板)を用いて補正するものや、例えば、特開昭62-19737号公報に記載されているように、濃度既知の外部反射基準板(外部基準板)を用いて補正するものが知られている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ここで、従来の反射率 測定装置は、光源からの光を試験紙で反射させ、その反 射光の強度を光検出器により測定するものであるため、 光源から光検出器までの光路長が異なると、光検出器に より検出される反射光強度が異なるため、測定誤差とな る。光源と光検出器は、測光ヘッド内に一体的に取り付 けられているため、光路長は、測光ヘッドと試験紙との 間の距離で決定される。反射率測定の精度を向上するた めには、測光ヘッドと試験紙との間の距離を所定距離に

2

対して±200μm程度の精度で設定する必要があるに も拘わらず、従来の反射率測定装置の組立時において は、各部品を組み上げるだけあるため、組立時の機差に より、測光ヘッドと試験紙との間の距離がばらつくた め、測定精度に誤差があるという第1の問題があった。 また、装置の修理や部品の交換等を行い、装置を再組立 した場合にも、同様の問題が生じるものである。

【0005】また、内部基準板を用いる光源ドリフトの 補正方法では、内部基準板は装置内部に常に設置してあ るため、汚れ、変性を回避できないものであり、一方、 外部基準板は補正の都度、装置にセットする必要がある ため、毎回測定ができず、安定した光源ドリフトの補正 ができないという第2の問題があった。

【0006】本発明の第1の目的は、測光ヘッドと試験 紙との間の距離のばらつきを回避して、測定精度の向上 した反射率測定装置を提供することにある。

【0007】また、本発明の第2の目的は、基準板の汚 れ、変性を回避できるとともに、測定の度毎に、毎回光 源ドリフトの補正を行え、測定精度の向上した反射率測 定装置を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】 (1) 上記第1の目的を 達成するために、本発明は、光源と受光部を有する測光 ヘッドを有し、光源からの光を被測定体に照射して、被 測定体の反射光を上記受光部により受光して反射強度を 求めるとともに、基準反射板からの反射強度との関係に 基づいて、被測定体の絶対反射率を求める反射率測定装 置において、上記基準板からの反射強度を複数回測定 し、この複数回の測定結果に基づいて、反射率測定の正 確性若しくは再現性を判断する算出部と、上記被測定体 30 を保持する台と上記測光ヘッドの間の距離を調整する距 離調整手段とを備え、上記算出部による正確性若しくは 再現性の判断結果に基づいて、上記被測定体の台と上記 測光ヘッドとの位置関係を調節可能としたものである。 かかる構成により、被測定体の台と測光ヘッドとの位置 関係を調節可能とし、測光ヘッドと被測定体との間の距 離のばらつきを回避して、測定精度を向上し得るものと なる。

【0009】(2)上記(1)において、好ましくは、 さらに、上記測光ヘッドは、複数の被測定体の上を走査 40 可能であり、上記基準反射板は、上記測光ヘッドから見 た反射率が等しく、かつ、上記測光ヘッドの走査方向に 離されて配置された複数の基準反射板から構成され、上 記算出部は、これらの複数の基準反射板からの反射強度 に基づいて、上記測光ヘッドの水平度を判断するととも に、上記算出部による水平度の判断結果に基づいて、上 記測光ヘッドの水平度を調節可能としたものである。か かる構成により、測光ヘッドの水平度を調節可能とし、 測定精度を向上し得るものとなる。

【0010】 (3) 上記 (1) において、好ましくは、 50 【0015】試験紙10の上には、複数の試薬パッド1

上記算出部は、上記基準板からの複数回の反射強度の測 定結果に基づいて、ドリフトの異常を判断するようにし たものである。かかる構成により、ドリフト異常を判断 して、ドリフト異常を回避することにより、測定精度を 向上し得るものとなる。

【0011】(4)上記(1)において、好ましくは、 上記基準板は、上記測光ヘッドから見た反射率が異なる 複数の基準板から構成され、上記算出部は、上記複数の 基準板に対する反射強度の差に基づいて、感度異常を判 断するようにしたものである。かかる構成により、感度 異常を判断して、感度異常を回避することにより、測定 精度を向上し得るものとなる。

【0012】 (5) 上記 (1) において、好ましくは、 上記基準板は、内部基準板と、外部基準板とから構成さ れ、上記外部基準板は、上記測光ヘッドから見た反射率 が異なる複数の外部基準板から構成され、上記算出部 は、上記複数の外部基準板に対する反射強度と、上記内 部基準板に対する反射強度の差に基づいて、上記内部基 準板の汚れ度を判断するようにしたものである。かかる 20 構成により、内部基準の汚れ度を判断して、汚れを解消 することにより、測定精度を向上し得るものとなる。

【0013】(6)上記目的を達成するために、本発明 は、光源と受光部を有する測光ヘッドを有し、光源から の光を被測定体に照射して、被測定体の反射光を上記受 光部により受光して反射強度を求めるとともに、基準反 射板からの反射強度との関係に基づいて、被測定体の絶 対反射率を求める反射率測定装置において、上記基準板 は、内部基準板と、外部基準板とから構成され、上記外 部基準板は、上記測光ヘッドから見た反射率が異なる複 数の外部基準板から構成され、この複数の外部基準板の 内の一つの外部基準板の測光ヘッドから見た反射率が上 記内部基準板の測光ヘッドから見た反射率と等しく設定 され、上記内部基準板に対する反射強度と、上記複数の 外部基準板に対する反射鏡殿との関係に基づいて、複数 の補正係数を求めると共に、上記被測定体に対する反射 強度と上記内部基準板に対する反射強度との関係に基づ いて求められた反射率を上記複数の補正係数の内の被測 定体に応じた一つの補正係数を用いて補正して絶対反射 率を求める算出部を備えるようにしたものである。かか る構成により、内部基準板の汚れ、変性を回避できると ともに、測定の度毎に、毎回光源ドリフトの補正を行 え、測定精度を向上し得るものとなる。

[0014]

【発明の実施の形態】以下、図1~図9を用いて、本発 明の一実施形態による反射率測定装置の構成について説 明する。最初に、図1を用いて、本実施形態による反射 率測定装置のシステム構成について説明する。図1は、 本発明の一実施形態による反射率測定装置のシステム構 成を示すプロック図である。

2 a, 1 2 b, …, 1 2 f が保持されている。試薬パッ ド12a, …, 12fは、それぞれ、測定項目に対応す る試薬を保持している。試薬パッド12a, …, 12f は、基板10の上に載置された吸収紙と、この吸収紙の 上に載置された試薬と、この試薬の上から吸収紙及び試 薬を保持するナイロンメッシュ等から構成されている。 試薬として、ブドウ糖測定用試薬を保持することによ り、ブドウ糖測定用試験パッドとなり、また、タンパク 質測定用試薬を保持することにより、タンパク質測定用 目の測定を行う場合には、試験紙10の上には、10項 目の測定項目に対応する試薬を保持した10個の試験パ ッドが保持される。測定検体である尿等は、試薬パッド 12a、…、12fの上に滴下され、試薬と検体が反応 して、検体の測定項目の濃度等に応じて、試薬が発色す る。試薬は、粉末状のものを固めたものであり、試薬の 種類の相違によって、試薬パッド12a, …, 12fの 高さH1は、それぞれ少しづつ相違している。

【0016】基板14の上には、内部反射基準板14a が保持されている。内部反射基準板14aは、例えば、 既知の反射率を有するプラスチック板が用いられる。内 部反射基準板14aとしては、例えば、反射率が60% のグレーのプラスチック板が用いられる。

【0017】試験紙10及び基板14の上には、測光へ ッド20が配置されている。測光ヘッド20は、矢印A 方向に往復動可能である。測光ヘッド20の内部には、 ホルダ22に固定された光源であるLED (発光ダイオ ード) 24a, 24bと、フォトダイオード等の光検出 器26と、レンズ28とが備えられている。ここで、試 薬パッド12の厚さをH1とし、試薬パッド12の上面 30 から測光ヘッド20の下端まで距離(高さ)をH2とす

【0018】LED24a, 24bは、図示に例では2 つであるが、実際には、3種類の波長λ1,λ2,λ3 の光を出射する3種類のLEDが3個づつ、合計9個備 えられている。ここで、3種類の波長 11, 22, 23 とは、試薬の発色に応じたものであり、例えば、470 nm, 555nm, 620nmである。そして、例え ば、470nmの中心波長の光を出射する3個のLED 24aが、レンズ28の周囲に等間隔で配置されてお り、試験パッド12に均一に光が照射されるようにして いる。同様にして、555nm, 620nmの中心波長 の光を出射する3個のLED24が、それぞれ、レンズ 28の周囲に等間隔で配置されている。3種類のLED 24が、順次点灯されることにより、3種類の波長入 1, λ2, λ3の光が順次試薬パッド12に照射され る。

【0019】試薬パッド12によって反射した光は、レ ンズ28によって光検出器26に集光される。光検出器 26は、受光した反射光の強度に応じた電気信号を出力 50 0Aは、矢印B1方向に搬送されながら、試薬パッド1

する。光検出器26が出力する電気信号は、A/D変換 器30によってディジタル信号に変換され、濃度算出部 40によって、最終的な測定項目毎の濃度の算出が行わ れる.

【0020】濃度算出部40は、反射率変換部41と、 反射率テーブル42と、補正係数テーブル43と、濃度 換算テーブル44と、最終濃度算出部45とから構成さ れている。反射率変換部41は、A/D変換器30から 入力した反射光強度のディジタル信号を、反射率テーブ 試験パッドとなる。1つの検体に対して、同時に10項 10 ル42に記憶された内部基準の反射率のデータと、補正 係数テーブル43に記憶された補正係数を用いて、反射 率に変換する。内部基準の反射率データ及び補正係数の 詳細については、図6を用いて後述する。最終濃度算出 部45は、反射率変換部41によって変換された反射率 を、濃度換算テーブル44に記憶された換算値に基づい て、濃度値に変換する。

> 【0021】濃度算出部40には、プリンタ52、操作 パネル54、ホストコンピュータ56、記憶媒体58等 が接続されている。濃度算出部40によって算出された 20 各検体の各項目毎の濃度値は、プリンタ52によってプ リントアウトされ、操作パネル54の液晶ディスプレイ (LCD) に表示され、ホストコンピュータ56に出力 され、記憶媒体58に記憶される。

【0022】次に、図2及び図3を用いて、本実施形態 による反射率測定装置の内部構成について説明する。図 2は、本発明の一実施形態による反射率測定装置の内部 構成を示す斜視図であり、測光ヘッドを保持する測光ユ ニットを取り外した状態を示している。また、図3は、 本発明の一実施形態による反射率測定装置の内部構成を 示す斜視図であり、外部基準板を引き出した状態を示し ている。図2及び図3において同一符号は、同一部分を 示している。

【0023】最初に、図2に示すように、金属製の板状 のベース60の上に、搬送台ベース62が取り付けられ ている。搬送台ベース62の上には、搬送台64が載置 されている。搬送台64の上には、複数の試験紙10 A, 10B, 10Cが載置されるとともに、図示しない 搬送機構により、それぞれ、X軸方向の矢印B1,B 2. B3方向に搬送される。搬送機構による試験紙10 40 の搬送動作は、制御ユニット66によって制御される。 試験紙10Aの上には、例えば、10種類の試薬パッド 12a, 12b, …, 12jが保持されており、1つの 検体に対して10種類の測定項目を測定することができ る。試験紙10は、予めカセット等の内部に収納されて おり、図示しない試験紙引出し機構によりカセットから 引き出されて、搬送台64の上の試験紙10Aが載置さ れている場所に載置される。この位置において、自動ピ ペッタ等を用いて尿等の検体が分注され、試薬パッド1 2 a, …, 12 j の上に滴下される。その後、試験紙1

2 a, …, 1 2 j 中の測定項目毎の試薬と検体の反応が 進行して、試薬が発色する。

【0024】また、図示の例では、搬送台64の右側端 部の上面には、外部基準板16が載置されている状態を 示している。なお、外部基準板16は、Y軸方向に5種 類の外部基準板が設置されているものであり、その詳細 については、図4を用いて後述する。また、外部基準板 16を搬送台64の上に設置するのは、外部基準板16 を用いた補正を行う場合であり、この際には、搬送台1 6上には、試験紙10A, 10B, 10Cは設置されな 10 いものであり、また、試験紙10A, 10B, 10Cに よる検体の反射率の測定時には、外部基準板 1 6 は搬送 台16の上には設置されないものであるが、ここでは、 搬送台16上における試験紙10A, 10B, 10Cの 搬送状況と外部基準板16の設置位置を示すため、試験 紙10A, 10B, 10Cと試験紙10A, 10B, 1 0 Cを同時に図示している。

【0025】外部基準板16のY軸方向の隣接位置に は、内部基準板14が設置されている。通常の測定時に 板16が図示されている位置まで、試験紙10が移動し てくる。試験紙10Aが図示されている位置から外部基 準板16が図示されている位置まで、試験紙10が移動 するのに要する時間は、例えば、1分であり、この時間 が試薬と検体の反応時間となっている。

【0026】外部基準板16及び内部基準板14の上の 位置、即ち、試験紙10及び内部基準板14の上の位置 (2軸方向の位置)には、測光窓72が設けられてい る。この測光窓72の上を、図3を用いて後述するよう 動して、外部基準板16(若しくは試験紙10)及び内 部基準板 1 4 に、光源からの光を照射し、反射光を検知 する。

【0027】また、ベース60の上には、4本の支柱8 2A, 82B, 82C, 82Dが固定されている。 支柱 82A, 82B, 82C, 82Dの上端部には、調整ネ ジ84A, 84B, 84C, 84Dが取り付けられてい る。図3を用いて後述するように、測光ヘッドを保持す る測光ユニットは、調整ネジ84A、84B、84C、 の上に保持される。そして、六角ドライバ等を用いて調 整ネジ84A, 84B, 84C, 84Dを回すことで、 測光ヘッドと搬送台64の間の距離を調整することがで きる。

【0028】次に、図3に示すように、測光ヘッド20 を保持する測光ユニット70は、調整ネジ84A、84 B. 84C. 84Dを介して、支柱82A, 82B, 8 2C, 82Dの上に保持される。測光ユニット70の中 の測光ヘッド20は、矢印C方向に移動して、外部基準 板16 (若しくは試験紙10)及び内部基準板14に、 50 は、第2の外部基準板16b1,16b2と同じ高さで

光源からの光を照射し、反射光を検知する。

【0029】また、図3は、搬送台64を、X軸上のD 方向に引き出した状態を示している。このように、搬送 台64をD方向に引き出すことにより、搬送台64の上 に外部基準板16を設置することができる。外部基準板 16の設置が終了すると、矢印Dと反対方向に搬送台6 4を押し込むことにより、測光ヘッド20の真下の位置 に外部基準板16を設置することができる。

【0030】次に、図4を用いて、本実施形態による反 射率測定装置に用いる外部基準板16の第1の構成につ いて説明する。図4は、本発明の一実施形態による反射 率測定装置に用いる外部基準板の第1の構成を示す斜視 図である。

【0031】外部基準板16は、所定の反射率R1を有 するプラスチック製の反射板である。外部基準板16の 中央の破線で示す領域16aが、第1の外部基準として 機能する。また、領域16aの両側には、第2の外部基 準板16b1,16b2が外部基準板16の上に取り付 けられている。第2の外部基準板16b1,16b2 は、外部基準板16は設置されておらず、この外部基準 20 は、外部基準板16と同じ反射率R1を有するプラスチ ック製の反射板であり、その高さは、h1である。ま た、第2の外部基準板16b1,16b2の両側には、 第3の外部基準板16c1,16c2が外部基準板16 の上に取り付けられている。第3の外部基準板16 c 1, 16 c 2は、外部基準板 16 と同じ反射率 R 1を有 するプラスチック製の反射板であり、その高さは、h2 である。

【0032】外部基準板16,第2の外部基準板16b 1, 16 b 2, 第3の外部基準板16 c 1, 16 c 2の に、測光ユニットの中の測光ヘッドが、矢印C方向に移 30 反射率R1は、例えば、60%である。第2の外部基準 板16b1、16b2の高さh1は、100~300μ mであり、例えば、200μmである。また、第3の外 部基準板16c1,16c2の高さh2は、第2の外部 基準板16 b 1, 16 b 2 の高さ h 1 よりも、100~ 300μm高くなっており、例えば、400μmであ る。即ち、外部基準板16,第2の外部基準板16b 1, 16 b 2, 第3の外部基準板16 c 1, 16 c 2の 反射率R1はいずれも同じであるが、測光ヘッドの中の 光源や光検出器との距離が僅かに違っており、光路長が 84 Dを介して、支柱82A, 82B, 82C, 82D 40 異なるため、測光ヘッドから見た反射率が異なるもので

> 【0033】このように、本実施形態においては、外部 基準板として、反射率が同じであるが、高さの異なる3 種類の外部基準を備えることにより、測光ヘッドから見 た反射率が異なる3種類の外部基準を備えるものであ

> 【0034】また、このとき、基板14の上に保持され ている内部反射基準板14 a は、外部基準板16と同じ 反射率R1(=60%)を有しており、その高さh1

ある。換言するならば、第2の外部基準板16b1.1 6 b 2 は、測光ヘッドから見た反射率が内部基準板 1 4 aと同じものであり、第1の外部基準として機能する領 域16 a は、測光ヘッドから見た反射率が内部基準板1 4 a より小さいものであり、第3の外部基準板16c 1. 16 c 2は、測光ヘッドから見た反射率が内部基準 板14aより大きいものである。即ち、内部基準板14 a を基準として、この反射率と等しいもの、この反射率 より小さいもの、この反射率より大きいものの3種類の 外部基準板16を用いている。

【0035】次に、図5を用いて、本実施形態による反 射率測定装置による装置の性能評価の方法について説明 する。図5は、本発明の一実施形態による反射率測定装 置による装置の性能評価処理の内容を示すフローチャー トである。

【0036】最初に、ステップs100において、濃度 算出部40は、装置がスタンパイ状態において、光源で あるLED24の光量をチェックする。スタンバイ状態 においては、図1に示した測光ヘッド20は、内部基準 板 1 4 a の上に位置している。 3 種類の波長 (\lambda 1 , \lambda 20 2. A3)のLED24を、各波長毎に順次点灯すると ともに、そのときの光検出器26の出力がA/D変換器 26によりディジタル信号に変換され、濃度算出部40 に取り込まれる。濃度算出部40は、その値が、予め設 定した値Vに対して、例えば、V±0.03Vの範囲内 にあるかどうかをチェックする。図1に示した操作パネ ル54には、検出された値と同時に、設定値及びその上 限値下限値が表示される。

【 0 0 3 7 】 設定範囲外である場合には、ステップ s 1 05において、オペレータは、LED24に供給する電 30 圧を、ボリューム等を用いて調整し、操作パネル54に 表示される検出された値が、設定範囲内となるようにす

【0038】光量チェックが終了すると、次の光度計チ エックを行う前に、オペレータは、光度計チェックの準 備として、図3に示したように、搬送台64を引き出し て、外部基準板16をセットする。その後、搬送台64 を元の位置に戻すことにより、外部基準板16は、測光 ヘッド20の下の位置にセットされる。

【0039】次に、ステップs110において、オペレ 40 ータは、装置の操作パネル54から光度計チェックを選 択することにより、以下の各ステップによる光度計チェ ックを開始する。

【0040】ここで、図6を用いて、光度計チェック時 の操作パネル54の表示例について説明する。図6は、 本発明の一実施形態による反射率測定装置における光度* * 計チェック時の操作パネルの表示例の説明図である。

10

【0041】光度計チェック時には、図6に示した操作 パネル54の表示を見ながら、測定回数nを入力する。 測定回数nは、n=1からn=30の範囲で選択できる ようになっている。測定回数 n の入力は、操作パネル 5 4に備えられているテンキーから行うことができる。ま た、内部基準板14aを新品と交換したとき、最初の調 整時は初期化を(YES)にする。そして、操作パネル5 4上にあるスタートキーを押すことにより、光度計チェ 10 ックが開始する。

【0042】光度計チェック時には、濃度算出部40 は、図3に示したように、測光ヘッド20が矢印C方向 に移動するように制御する。この結果、測光ヘッド20 は、図4に示した第3外部基準板16c1, 第2外部基 準板 1 6 b 1, 第 1 外部基準板 1 6 a, 第 2 外部基準板 1662, 第3外部基準板16c1及び内部基準板14 aの上を順次移動しながら、各基準板の上で、3種類の 波長の光を出射するLED24を順次点灯した場合にお ける、それぞれの波長に対する反射光を光検出器26に よって検出する。また、内部基準板14aの上では、L ED24を全て消灯状態にした場合における反射光を光 検出器26によって検出する。検出された値は、A/D 変換器30によってディジタル信号に変換され、記憶媒 体58に記憶される。なお、内部基準板14aから検出 された値については、調整初期、あるいは内部反射板1 4 a を交換したときは、この日を始めとして、その後5 日間分を平均値化するための測定値とし、日付とカウン ト値を記録する。また、この測定は、15秒おきに測定 回数n回分行われる。

【0043】ここで、検出値を、それぞれ、次のように 表すものとする。 I off(n)は、内部基準板 1 4 a の上 で、全てのLED24が消灯した場合の検出値である反 射強度であり、迷光等によって生じる反射強度オフセッ ト値である。ここで、nは、測定回数であり、これにつ いては、以下も同様である。また、 I ref. meas. (n, λi) は、内部基準板14aについて、各波長(λi=λ1, λ2, λ3)毎に求められた反射強度である。さらに、 Cref. meas. cl(n, \lambda i), Cref. meas. bl(n, \lambda i), Cref. meas. a(n, li), Cref. meas. b2(n, li), Cref. meas. c2 (n, li)は、各外部基準板16cl, 16b, 16a, 16b2, 16c2について、各波長 (λi=λ1, λ 2. 13)毎に求められた反射強度である。 【0044】次に、濃度算出部40は、以下の式 (1), (2), (3), (4), (5), (6) に基

づいて、各反射強度からオフセット値 I off(n)を差し引 いた値である

 $l \operatorname{ref}(n, \lambda i) = l \operatorname{ref. meas.}(n, \lambda i) - l \operatorname{off} \cdots (1)$

Cref. C1 (n, λ i) = Cref. meas. (n, λ i) — 1 off ... (2)

Cref. B1 (n, λ i) = Cref. meas. (n, λ i) — I off ... (3)

Cref. $A(n, \lambda i) = Cref. meas. (n, \lambda i) - I off \cdots (4)$

12

Cref. B2(n, λ i) = Cref. meas. (n, λ i) — I off ... (5) Cref. C2(n, λ i) = Cref. meas. (n, λ i) — I off ... (6)

を測定回数n回分計算する。

. 【0045】次に、ステップs115において、濃度算 出部40は、正確性及び再現性をチェックする。正確性 は、Cref.Cl(n, li), Cref.Bl(n, li), Cref.A(n, l i), Cref. B2(n, λi), Cref. C2(n, λi) のそれぞれの n 回の平均値が、期待される範囲内かどうかチェックす る。例えば、Cref. Cl (n, λi)の平均値である Cave. re f. C1(λ1)が、所定値Wに対して、一定範囲(例えば、 ±5%の範囲)内にあるかどうかを判断し、一定範囲内 にあれば正確性はOKであると判断し、一定範囲外であ れば正確性はNGであると判断する。また、再現性は、 n回測定のCV(変動係数)が一定範囲内かどうかチェ ックする。例えば、CVが2%以下の場合には、再現性 はOKであると判断し、CVが2%より大きい場合に は、再現性はNGであると判断する。

11

【0046】正確性及び再現性がOKである場合には、 ステップ s 1 2 5 に進み、いずれかが N G である場合に は、プリンタ52や操作パネル54にアラームやメッセ 20 5日経過していないときには、ステップs140に進 ージを出力し、ステップs120に進む。

【0047】正確性若しくは再現性がNGの場合には、 ステップs120において、オペレータは、測光ヘッド 20と搬送台64の間の位置関係、即ち、測光ヘッド2 0と搬送台64の間の距離、換言すると、測光ヘッド2 0の高さの調整や、LED24の再調整を行う。正確性 のチェック結果が、一定の範囲よりも高くなっている場*

* 合には、調整ネジ84を回して測光ヘッド20を高くす る。また、必要に応じて、LED24に供給する電圧を 低くする。一方、正確性のチェック結果が、一定の範囲 よりも低くなっている場合には、調整ネジ84を回して 測光ヘッド20を低くする。また、必要に応じて、LE D24に供給する電圧を高くする。さらに、例えば、C ave. ref. C1(\lambda 1), Cave. ref. C1(\lambda 2), Cave. ref. C1 10 (λ3)の内、Cave. ref. C1(λ1)の正確性若しくは再現 性のみがNGである場合には、波長 l1のLED 24 a に供給する電圧を調整する。調整が終了すると、再び、 ステップs110に戻り、光度計チェックを再実行す

【0048】正確性及び再現性がOKの場合には、ステ ップs125において、濃度算出部40は、内部反射基 準板14aを初期化してから15日以上経過したか否か を判定し、15日以上経過したときは、ステップs13 0に進んで内部基準板14aの汚れチェックを行い、1

【0049】ステップs130において、濃度算出部4 0は、以下の式(7), (8), (9), (10), (11) に従って、Irefの値と、Cref.Cl(n, li), C ref. B1 (n, λi), Cref. A(n, λi), Cref. B2(n, λi), C ref.C2(n, λi)の差Dを求める。

Dref. Cl (n, λ i) = Cref. Cl (n, λ i) - I ref (n, λ i) ... (7) Dref. Bl $(n, \lambda i) = Cref. Bl(n, \lambda i) - Iref(n, \lambda i) \cdots (8)$ Dref. $A(n, \lambda i) = Cref. A(n, \lambda i) - Iref(n, \lambda i) \cdots (9)$ Dref. B2(n, λ i) = Cref. B2(n, λ i) - I ref(n, λ i) ··· (10) Dref. C2(n, λ i) = Cref. C2(n, λ i) - I ref(n, λ i) ... (11)

差Dがすべてある一定以上(例えば、5%以上)外れた ときで、3波長とも差があるときには、濃度算出部40 は、内部反射基準板14aが汚れたと判断し、プリンタ 52や操作パネル54に、アラームやメッセージを出力 し、ステップ s 1 3 5 に進む。内部反射板 1 4 a の汚れ が無いと判断された場合は、ステップ s 1 4 0 に進み、 水平度チェックを実行する。ステップs135におい て、オペレータは、内部反射板14aを清掃する。清掃 40 後、ステップs110に戻り、再び光度計チェックを実 施する。

【0050】内部反射板14aの汚れが無いと判断され た場合は、ステップs140において、濃度算出部40 は、水平度チェックを実行する。図4において説明した ように、外部基準板16b1と、外部基準板16b2 と、内部基準板14aの反射の程度は等しいため、これ らからの反射強度は本来等しくなるものである。また、 外部基準板16c1と、外部基準板16c2の反射の程※ ※度は等しいため、これらからの反射強度は本来等しくな るものである。そこで、濃度算出部40は、そこで、上 式(8)において求めた外部基準板16b1と内部基準 板14aに対する反射強度の差Dref.Bl(n, li)が、例 えば、内部基準板14aに対する反射強度よりも一定値 (例えば、1~2%) 以上の場合、水平度の異常と判断

【0051】なお、水平度の異常の判定は、外部基準板 16b1と内部基準板14aに対する反射強度の差Dre f. B1 (n, λi)だけでなく、以下の式(12), (13) により、外部基準板16c1と外部基準板16c2に対 する反射強度の差Dref.C(n, li), 若しくは、外部基準 板16b1と外部基準板16b2に対する反射強度の差 Dref.B(n, li)から求めることができるものである。水 平度をチェックするためには、対象となる基準板の距離 が離れている方がよいため、差Dref.C(n, li)の方が、 差Dref. B(n, λi)よりも正確となる。

Dref. $C(n, \lambda i) = Cref. Cl(n, \lambda i) - Iref. C2(n, \lambda i) \cdots (12)$

Dref. B(n, λ i) = Cref. B1(n, λ i) - I ref. B2(n, λ i) ··· (1 3)

水平度がOKである場合には、ステップ s 1 5 0 に進 み、NGである場合には、プリンタ52や操作パネル5 4にアラームやメッセージを出力し、ステップ s 1 5 5 に進む。

【0052】水平度がNGである場合には、オペレータ は、高さの再調整を行う。高さ調整は、図2に示した位 置調整用のネジ84A, 84B, 84C, 84Dを六角 ドライバで回すことで測光ヘッド20と搬送台64の距 離を調節する。

【0053】例えば、外部基準板16b1に対する反射 強度 Cref. B1(n, λi)が、内部基準板 1 4 a に対する反 射強度 I ref (n, λ i) よりも大きい場合には、ネジ84B を回して外部基準板16b1側の測光ヘッド20の高さ を低くするか、ネジ84Aを回して内部基準板14a側 の測光ヘッド20の高さを高くする。外部基準板16b 1に対する反射強度Cref.B1(n, li)が、内部基準板1 4 a に対する反射強度 I ref(n, λi)よりも小さい場合に は、ネジ84Bを回して外部基準板16b1側の測光へ ッド20の高さを高くするか、ネジ84Aを回して内部 20 基準板14a側の測光ヘッド20の髙さを低くする。髙 さ調整が終了すると、再び、ステップ s 1 1 0 に戻り、 光度計チェックを再実行する。

【0054】ここで、図7を用いて、ドリフトについて 説明する。図7は、ドリフトの説明図である。図7にお いて、横軸は測定回数nを示しており、縦軸は、内部基 準板14aの反射強度 I ref. meas. (λi)を示している。 【0055】反射強度 I ref. meas. (λi)は、一般に、測 定回数nが増えるに従って、減少する。これは、LED 2.4 の発光強度が時間と共に低下することによるもので 30 ある。ここでドリフトチェックは、反射強度 I ref. mea *

> Cref. Bx(λ i) = (Cref. B1(λ i) + Cref. B2(λ i)) /2 ... (14) Cref. $Cx(\lambda i) = (Cref. Cl(\lambda i) + Cref. C2(\lambda i)) / 2 \cdots (1.5)$

ここで、第1の外部反射板16aと第2の外部反射板1 6 b 1, 1 6 b 2 の高さの差は一定であるため、通常、 第1の外部反射板16aからの反射強度と第2の外部反 射板16b1, 16b2からの反射強度の差は所定値に なる。それに対して、LED24の発光強度が低下した り、光検出器26の検出感度が低下すると、上述した反 射強度の差は、所定値よりも小さくなる。第2の外部反 40 合が多いため、光検出器26を交換する。3波長ҳ1, 射板16b1,16b2と第3の外部反射板16c1, 16 c 2 の間でも同様のことが生じる。

【0060】そこで、濃度算出部40は、(Cref.Cx (λi) - Cref. Bx(λi), (Cref. Bx(λi) - Cref. A (λi)), 若しくは (Cref.Cx(λi)-Cref.A(λi)) が、予め設定した値よりも低下した場合、例えば、予め 設定した値の1/3まで低下した場合には、感度異常と 判断し、それ以上の場合は感度正常と判断する。

【0061】感度正常の場合には、ステップ s 170に 進み、感度異常の場合には、プリンタ52や操作パネル 50 求めた正確性,再現性のデータを、プリンタ52及び操

* s. (λi)の低下の程度によって、LED 2 4 の発光強度 の低下の度合いをチェックするものである。

14

【0056】水平度がOKである場合にはステップs1 50において、濃度算出部40は、ドリフトチェックを 実行する。濃度算出部40は、内部基準板14aの反射 強度 I ref. meas. (λi)の内、第1回目の測定値 I ref. me as. 1(λi)と第5回目の測定値 I ref. meas. 5(λi)との差 (Iref. meas. 1(λi) - Iref. meas. 5(λi)) 、及び第6 10 回目の測定値 I ref. meas. 6(λi)と第10回目の測定値 Iref. meas. 10(λi)との差(Iref. meas. 6(λi) — Ire f. meas. 10(λi)を求め、両者の差が一定値以上(例え ば、(Iref.meas.1(\lambda i)-Iref.meas.5(\lambda i)) に対し τ , (I ref. meas. $6(\lambda i) - I$ ref. meas. $10(\lambda i) \approx 5\%$ 以上) 低下した場合をドリフト異常と判断し、それ以下 の場合はドリフト正常と判断する。

【0057】ドリフト正常の場合には、ステップs16 0に進み、ドリフト異常の場合には、プリンタ52や操 作パネル54にアラームやメッセージを出力し、ステッ プs155に進む。

【0058】ドリフト異常の場合には、ステップ s 15 5において、オペレータは、LED24や光検出器26 を交換する。交換が終了すると、再び、ステップ s 1 1 0に戻り、光度計チェックを再実行する。

【0059】ドリフトが正常である場合には、ステップ s160において、濃度算出部40は、感度チェックを 実行する。濃度算出部40は、以下の式(14), (1 5) に基づいて、第2の外部反射板16b1, 16b2 の反射強度の平均値 Cref. Bx(λi)、及び第3の外部反 射板 1 6 c 1, 1 6 c 2 の反射強度の平均値 Cref. Cx (λi)を求める。

54にアラームやメッセージを出力し、ステップs16 5に進む。

【0062】感度異常の場合には、ステップ s 165に おいて、オペレータは、LED24や光検出器26を交 換する。3波長 11, 22, 23のそれぞれについて感 度異常となる場合には、光検出器26が劣化している場 λ2, λ3の内1つの波長について感度異常となる場合 には、該当する波長のLED24が劣化している場合が 多いため、とりあえず、該当するLED24に対して供 給する電圧を調整し、それでも、異常である場合には、 該当する波長のLED24を交換する。交換が終了する と、再び、ステップs110に戻り、光度計チェックを 再実行する。

【0063】感度が正常である場合には、ステップs1 70において、歳度算出部40は、ステップ。115で

作パネル54に出力する。 【0064】次に、ステップs175において、濃度算 出部40は、以下の式(16), (17), (18), *

> $Corr A (\lambda i) = I ref (\lambda i) / Cref. A (\lambda i)$ ×InputA ... (16)

> Corr B $(\lambda i) = I \operatorname{ref} (\lambda i) / \operatorname{Cref.B} (\lambda i)$ ×InputB ... (17)

> CorrC $(\lambda i) = I \operatorname{ref} (\lambda i) / \operatorname{Cref.C} (\lambda i)$ ×InputC ... (18)

> Corr B' $(\lambda i) = (Corr A (\lambda i) + Corr B (\lambda i)) / 2 \cdots (19)$

CorrC' $(\lambda i) = (CorrB(\lambda i) + CorrC(\lambda i)) / 2 \cdots (20)$

なお、式(16)におけるInputAは、第1の外部基準 からの入力値である。同様にして、式(17)における Input B 及び式 (18) におけるInput C は、第2の外部 基準板16b1、16b2及び第3の外部基準板16c 1. 16 c 2 から期待される反射率であり、操作パネル 54からの入力値である。

【0065】また、図4において説明したように、第1 の外部基準板16aと第2の外部基準板16b1,16 b 2の高さの差は一定、例えば、200μmとなってい る。そのため、高さの差が200μm以下、例えば、1 00μmに対する補正係数として、CorrB'(λi) は、式 (19) に示すように、補正係数CorrA (li) と補正係数 Corr B (λi) の平均値から求めている。同 様にして、Corr C'(λi)は、式(20)に示すよう に、補正係数CorrB (λi)と補正係数 CorrC (λi) の平均値から求めている。これらの補正係数CorrA(λ i) , CorrB (λi) , CorrC (λi) , CorrB' (λ i), Corr C'(λi)は、図1に示した補正係数テープ ル43に記憶される。

【0066】次に、未知濃度の試験紙について反射率の 測定を行った場合における上述した補正係数CorrA (λ 30 i), CorrB (λi), CorrC (λi), CorrB' (λ i), Corr C'(λi)を用いた補正方法について説明す る。

【0067】測定項目が例えば10種類ある場合、実際 の測定に先立って、各測定項目毎に、適用する補正係数 を、補正係数テーブル43から選択して、操作パネル5 4から入力する。この補正係数の選択は、試験紙10の 上の試薬パッド12a,…,12jの状態に応じてなさ れる。即ち、試薬の種類に応じて、試薬パッド12a, …, 12jの高さが僅かずつ相違している。従って、最 40 Aは、図示しない搬送機構により、搬送台64の上を、 も高さが低いものに対しては、補正係数CorrA(λi) が適用され、この試薬よりも高さが100μm高い試薬 については、補正係数CorrB'(λi)が適用される。 【0068】ここで、図8を用いて、本実施形態による 補正係数の選択状況について説明する。図8は、本発明 の一実施形態による反射率測定装置における補正係数の 選択状況の説明図であり、操作パネル54への表示状態 を示している。

【0069】図8に示すように、測定項目毎の試薬の状

* (19), (20) に基づいて5段階の補正係数CorrA (λi), CorrB (λi), CorrC (λi), CorrB' (λi), Corr C'(λi) を算出する。

16

入力する。図示する例では、例えば、潜血(RBC)に 板16aから期待される反射率であり、操作パネル54 10 対しては、補正係数CorrC(λi)を選択している。同 様にして、白血球(WBC)に対しては、補正係数Corr C(λi)を選択し、タンパク質(PRO)に対して は、補正係数Corr A (λi) を選択し、ビリルビン (B IL) に対しては、補正係数CorrB(li)を選択し、 ウロビリノーゲン(UBG)に対しては、補正係数Corr B'(\lambda i)を選択し、ケトン体(KET)に対して は、補正係数CorrA (li) を選択し、ペーハー (p H) に対しては、補正係数Corr C' (λi) を選択し、 亜硝酸塩 (NIT) に対しては、補正係数CorrB (λ 20 i)を選択し、ブドウ糖 (GLU)に対しては、補正係 . 数Corr B (λi) を選択し、補正用のパッド (COM) に対しては、補正係数CorrA(\lambda i)を選択している。 【0070】なお、本実施形態においては、基準となる 高さに対する補正係数だけでなく、この基準よりも、例 えば、100μm、200μm、300μm、400μ m高い試薬に対する補正係数を備えているため、試薬の ロット差により、試薬の高さが変化した場合でも、最適 な補正係数を選択することができる。また、新しい測定 項目が追加され、この測定項目に応じた試薬が用いられ る場合でも、試薬の高さの応じて、最適な補正係数を選 択することができる。

【0071】次に、本実施形態による反射率測定装置の 動作について説明する。図2に示したように、搬送台6 4の上に試験紙10Aがセットされると、試験紙10A の上にピペット等を用いてサンプル(測定検体)が滴下 される。試験紙10Aの上に10種類の測定項目に対応 した10種類の試薬パッド12a, …, 12jが保持さ れている場合、同一のサンプルが、10個の試薬パッド 12a, …, 12jにそれぞれ滴下される。試験紙10 矢印B1方向に搬送される。所定の反応時間(例えば、 1分)が経過すると、試験紙10Aは、測定窓72の下 に位置づけられる。

【0072】次に、図3に示したように、測光ユニット 72の中の測光ヘッドが矢印C方向に、測光窓72の上 を走査して、各試薬パッド12a,…,12jの反射強 度 Itf. meas. を測定する。このとき、各試薬パッド12 a, …, 12jの発射強度の測定に用いられる波長は、 3種類の波長の内、各測定項目毎に予め設定している1 態に応じて、操作パネル54から補正係数を選択して、 50 波長である。また、同時に、内部反射基準板14aの反 射強度 I ref. meas. とLED消灯時の反射強度 I off を

【0073】次に、濃度算出部40の反射率変換部41 は、各試薬パッドのオフセット補正後の反射強度Itf

I tf = I tf. meas. — I off

として算出する。また、内部反射基準板のオフセット補 正後の反射強度 I ref(λi)を、

I ref $(\lambda i) = I \text{ ref. meas.} - I \text{ off}$

反射強度 I ref (λi) は、反射率テーブル42に記憶さ

【0074】さらに、濃度算出部40の反射率変換部4 1は、各試薬パッドの絶対反射率Rtfを、

Rtf= (Itf /Iref (λi)) × (選択された補正係

として算出する。ここで、(選択された補正係数)と は、図8に示したように、各測定項目毎に、操作パネル から選択された補正係数CorrA (λi), CorrB (λ i) , CorrC (λi) , CorrB' (λi) , CorrC' (λ i) のいずれかであり、これらは、補正係数テーブル4 3に記憶されている。次に、濃度算出部40の最終濃度 算出部45は、絶対反射率Rtfから濃度換算テーブル4 4を用いて、濃度値に変換し、最終出力値とする。

【〇〇75】なお、上述した光度計チェックとは別に、 このルーチン測定中に内部反射板14aの汚れチェック をモニターする。光度計チェック実行時に初期化された 日から5日間の内部反射基準板14aの平均値算出を継 続する。5日間測定したらその平均値RX1を初期カウ のカウント値の平均値算出を各チェック日から手前5日 間で行うようにする。この平均値をRX2を最終カウン ト値として記録する。このとき、RX2-RX1の差が一 定以上になった場合、清掃あるいは交換を促すアラー ム、メッセージを出力する。

【0076】次に、図9を用いて、本実施形態による反 射率測定装置に用いる外部基準板16Aの第2の構成に ついて説明する。図9は、本発明の一実施形態による反 射率測定装置に用いる外部基準板の第2の構成を示す斜 視図である。

【0077】外部基準板16Aの上には、第1の外部基 準板16d1, 16d2, 16d3, 16d4と、第2 の外部基準板16e1, 16e2, 16e3と、第3の 外部基準板 1 6 f 1, 1 6 f 2, 1 6 f 3 が保持されて いる。外部基準板16d1, 16d2, 16d3, 16 d4, 16e1, 16e2, 16e3, 16f1, 16 f 2. 16 f 3 は、例えばプラスチック製の反射板であ り、その高さh1は全て等しく、基板14の上に保持さ れている内部反射基準板14aの高さh1と等しいもの である。

【0078】また、第2の外部基準板16e1, 16e 2. 16 e 3の反射率R 1は、基板 1 4 の上に保持され ている内部反射基準板14aの反射率R1(=60%) と等しいものである。一方、第1の外部基準板16d 1, 16 d 2, 16 d 3, 16 d 4の反射率R 2は、基 板14の上に保持されている内部反射基準板14 aの反 射率R1(=60%)よりも大きい反射率であり、例え ば、62%としている。そして、第3の外部基準板16 f 1, 16 f 2, 16 f 3の反射率R 3は、基板14の として算出する。内部反射基準板のオフセット補正後の 10 上に保持されている内部反射基準板 1 4 a の反射率 R 1 (=60%) よりも小さい反射率であり、例えば、58 %としている。

18

【0079】即ち、第1の外部基準板16d1,16d 2. 16 d 3. 16 d 4 と、第2の外部基準板16 e 1、16e2、16e3と、第3の外部基準板16f 1, 16 f 2, 16 f 3とは、髙さが同じであるが、反 射率がそれぞれ異なるため、測光ヘッドから見た反射率 が異なるものである。

【0080】このように、本実施形態においては、外部 20 基準板として、高さが同じであるが、反射板自体の反射 率の異なる3種類の外部基準を備えることにより、測光 ヘッドから見た反射率が異なる3種類の外部基準を備え るものである。そして、内部基準板148を基準とし て、この反射率と等しいもの、この反射率より小さいも の、この反射率より大きいものの3種類の外部基準板1 6 d, 16 e, 16 f を用いている。このようにして も、図4に示した外部基準板16と同様に、補正係数を 求めることができる。

【0081】以上説明したように、本実施形態によれ ント値として記録する。その後も内部反射基準板14a 30 ば、外部反射基準板を使って、測光ヘッドと搬送台の位 置関係をチェックでき、また、調整機構で微調整ができ るため、正確で、より安定な反射率の測定を行うことが できる。また、外部反射基準板と内部基準板の関係、内 部基準板と被測定体との関係の2段階を経ることでよ り、正確な反射率の測定を行うことができる。さらに、 外部反射基準板の反射率を多段階にすることで、補正係 数を設定でき、被測定体である試験紙の微妙な高さや状 態を補正できる。また、さらに、試薬の改良、試薬のロ ット変更、試薬の配置変更、新測定項目追加時にも、補 正係数を変更することで対応が可能である。また、光度 **計チェックを実行することにより、反射率を正確に出し** ているかの検証が簡便に行なえる。また、簡便な操作で 同時に水平度、再現性、正確性、ドリフト、感度の良否 判定が行え、組み立て・調整時、据付時、サービス時、 ユーザーメンテ時に判断や対処が容易になるものであ る。

[0082]

【発明の効果】本発明によれば、測光ヘッドと試験紙と の間の距離のばらつきを回避して、測定精度を向上する 50 ことができる。

【0083】また、基準板の汚れ、変性を回避できると ともに、測定の度毎に、毎回光源ドリフトの補正を行 え、測定精度を向上することができる。

19

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態による反射率測定装置のシ ステム構成を示すブロック図である。

【図2】本発明の一実施形態による反射率測定装置の内 部構成を示す斜視図である。

【図3】本発明の一実施形態による反射率測定装置の内 部構成を示す斜視図である。

【図4】本発明の一実施形態による反射率測定装置に用 いる外部基準板の第1の構成を示す斜視図である。

【図5】本発明の一実施形態による反射率測定装置によ る装置の性能評価処理の内容を示すフローチャートであ

【図6】本発明の一実施形態による反射率測定装置にお ける光度計チェック時の操作パネルの表示例の説明図で ある。

【図7】ドリフトの説明図である。

【図8】本発明の一実施形態による反射率測定装置にお 20 72…測光窓 ける補正係数の選択状況の説明図である。

【図9】本発明の一実施形態による反射率測定装置に用 いる外部基準板の第2の構成を示す斜視図である。

*【符号の説明】

10…試験紙

12…試薬パッド

14 a ···内部反射基準板

16…外部基準板

20…測光ヘッド

2 4 ··· L E D

26…光検出器

30…A/D変換器

10 40…濃度算出部

41…反射率変換部

42…反射率テーブル

43…補正係数テーブル

44…濃度換算テーブル

45…最終濃度算出部

54…操作パネル

60…ベース

6 2 …搬送台ベース

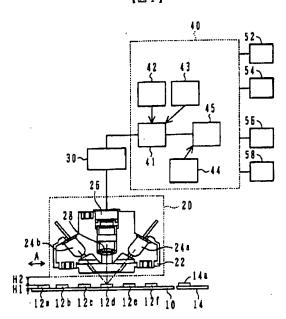
6 4 …搬送台

74…測光ユニット

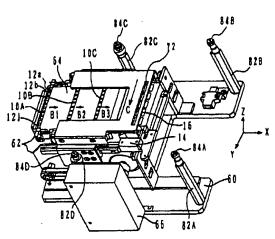
8 2 … 支柱

84…調整ネジ

【図1】

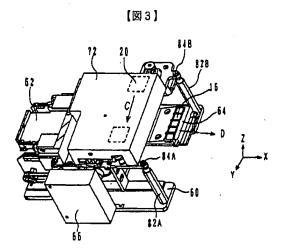


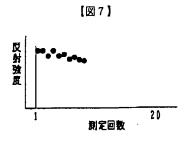
[図2]



【図6】

(光度計チェック) 劉定回数n (20) 1.30 内都基準板の初期化 (YES) Y/N 基準板を定位置にセットしてから START を押してください。

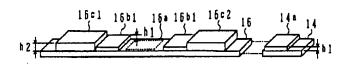




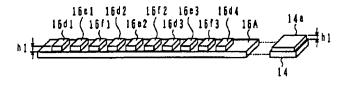
【図8】

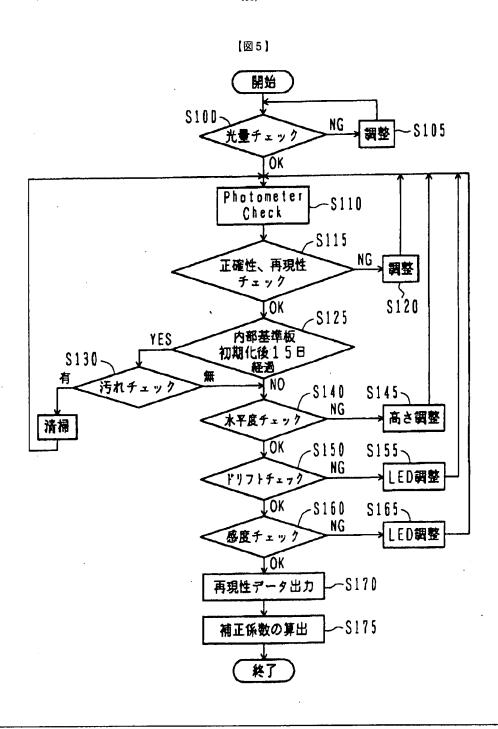
〈補正係数の入力〉							
RBC	(C)	KET	(A)				
WBC	(C)	рHТ	(C,)				
PRO	(A)	NIT	(B)				
BIL	(B)	GLU	(8)				
UBG	(B')	COM	(A)				

[図4]



【図9】





フロントページの続き

(72)発明者 飯田 圭一

茨城県ひたちなか市大字市毛1040番地 株 式会社日立サイエンスシステムズ内 (72)発明者 磯部 哲也

茨城県ひたちなか市大字市毛1040番地 株式会社日立サイエンスシステムズ内

Fターム(参考) 2G045 AA16 CB03 DA31 FA14 GC11 HA09 HA14 JA01 JA02 JA07 JA08 2G059 AA01 AA02 BB13 DD13 EE02 FF01 FF08 GG02 MM09 MM12 MM17

Family list 2 family member for: JP2001141644 Derived from 1 application

1 REFLECTANCE MEASURING APPARATUS

Inventor: TAKI MIKI; NAGARA SHINICHI; (+2)

Applicant: HITACHI LTD

IPC: G01N33/52; G01N21/01; G01N21/27 (+5)

Back to JP2001141644

Publication info: JP3650558B2 B2 - 2005-05-18 JP2001141644 A - 2001-05-25

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide